



Российская академия наук  
Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и  
медицинской химии РАН  
Отдел функциональных материалов для химических источников энергии  
Центр водородной энергетики АФК Система  
Российская научно-производственная компания Smart-Stat  
Малое инновационное предприятие ООО «ПРОМЕТЕЙ РД»  
«Научно-консалтинговый центр «Форум-СМ»

---

**Посвящается зо-летнему юбилею Совещаний  
Посвящается памяти профессора УКШЕ Евгения Александровича**

17-е Совещание с международным участием  
**«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИОНИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА»**

***ТРУДЫ СОВЕЩАНИЯ***

Московская обл., г. Черноголовка, 16 - 23 июня 2024 г.

## У-1-18. ИОНОПРОВОДЯЩИЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ СТЕКЛА С МЕТАЛЛОФИЛЬНЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ

**Томаев Владимир Владимирович<sup>1,2,3</sup>, Тверьянович Ю.С.<sup>2</sup>,**  
**Луньков С.С.<sup>2</sup>, Зайцева С.А.<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский технологический институт (технический университет), кафедра теоретических основ материаловедения

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

<sup>3</sup> Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург



**Томаев Владимир Владимирович**, к.ф.-м.н., доцент, Санкт-Петербургский технологический институт (технический университет), кафедра теоретических основ материаловедения.

**Научные интересы, область исследований:** Получение, исследование и применение халькогенидных стёкол, а также композитных материалов на основе халькогенидов, оксидов и галогенидов свинца, олова и серебра.

*e-mail:* tvaza@mail.ru

Гибкая электроника в настоящий момент интенсивно развивается [1]. Это обусловлено не только удобством использования гибких устройств, но и возможностью размещения их (включая различные сенсоры) непосредственно на контролируемых подвижных объектах, например человеческом теле [2,3].

Полупроводниковые материалы, применяемые в настоящий момент в гибкой электронике, могут быть разделены на три основные группы: неорганические нанокристаллические (включая углеродные), неорганические аморфные и органические полупроводники.

Первая группа материалов обладает относительно высокой стабильностью функциональных свойств, но малой гибкостью и пластичностью.

Органические полупроводники достаточно пластичны, но их свойства сравнительно быстро деградируют.

Аморфные полупроводники, представленные в основном аморфным кремнием, занимают промежуточное положение в этом ряду и имеют трудно регулируемые электронные свойства.

Отдельной группой перспективных материалов, используемых в гибкой электронике, могли бы быть пластичные стеклообразные материалы.

Однако стеклообразные материалы, как правило, характеризуются высокой хрупкостью, что обуславливает их низкую устойчивость к механической нагрузке и перепадам температуры. Тем не менее, обнаружено, что халькогенидные стекла с высоким содержанием серебра не только обладают значительной ионной проводимостью по серебру, но и, как было показано ранее [4], демонстрируют повышенную пластичность по сравнению с остальными халькогенидными стеклами.

Последнее связано со способностью атомов серебра к формированию

ненаправленных металлофильных связей при высокой их концентрации в сетке стекла.

С другой стороны известно, что стеклообразные твердые электролиты по сравнению с кристаллическими имеют ряд преимуществ: свойства стекол плавно меняются с изменением состава, как правило, проводимость стекла выше проводимости кристалла того же состава, стекла, как неупорядоченные системы, мало восприимчивы к посторонним примесям, кроме того, современные стекольные технологии позволяют изготовить из стекла изделие практически любой формы и т. д. [5,6].

Тем не менее, известно, что одним из востребованных материалов, для создания гибких сенсоров являются пластичные кристаллические неорганические полупроводники на основе  $\text{Ag}_2\text{S}$ ,  $\text{Ag}_2\text{Se}$ ,  $\text{Ag}_2\text{Te}$  [7-9], относящиеся к твёрдым электролитам и которые в настоящее время интенсивно исследуются для этих целей.

Обобщая вышесказанное, можно считать, что стеклообразные твердые электролиты способные включать в свой состав без потери стеклообразующей способности не менее 20 мол. % халькогенида серебра могут быть перспективными материалами, применяемыми в гибкой электронике.

Указанные обстоятельства обуславливают интерес к стеклообразным твердым электролитам на основе  $\text{Ag}_2\text{Se}$ .

Ранее, авторами [10-12] проведен анализ температуры стеклования халькогенидных стекол с ионной проводимостью в зависимости от

содержания халькогенидов серебра. В этой работе особенности изменения температуры стеклования стекол на основе халькогенидов серебра объясняются сосуществованием ковалентных связей серебро-халькоген ( $\text{Ag}-\text{Ch}$ ) и металлофильных связей серебро-серебро ( $\text{Ag}-\text{Ag}$ ). Большое количество систем демонстрирует общую взаимосвязь, позволяющую сделать вывод о том, что коэффициент связности серебра в халькогенидных стеклах существенно превышает его формальную степень окисления, поскольку серебро образует металлофильные связи в дополнение к ковалентным.

Ожидая, что металлофильные взаимодействия влияют не только на температуру стеклования, но и на многие другие важные свойства этих стекол, включая механизм ионной проводимости по серебру авторы предполагают дополнить свои исследования измерениями проводимости и выяснить влияние концентрации селенида серебра на проводимость.

Изучено влияние концентрации халькогенида серебра на релаксацию механических напряжений, пластичность стекол, взаимосвязь микротвердости и температуры размягчения стекла, энергию связи атомов серебра, ионную проводимость.

К важным результатам, помимо роста ионной проводимости стекол при увеличении содержания  $\text{Ag}_2\text{Se}$ , относятся кратное увеличение пластичности и, как следствие, более полная релаксация приложенного механического напряжения.

**Благодарности.** Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 24-23-00140.

#### **Список литературы**

- [1]. Shrivas K., Ghosale A., Bajpai P.K., Kant T., Dewangan K., Shankar R. // Microchemical Journal. 2020. V. 156. 104944. 11p.
- [2]. Zazoum B., Batoo K.M., Khan M.A.A. // Sensors. 2022. V. 22. P. 4653. <https://doi.org/10.3390/s22124653/>
- [3]. Chen H., Wei T.-R. Shi, X. // Materials Lab. 2023. V. 2. 230008.
- [4]. Tveryanovich Y. S., Fazletdinov T. R., Tverjanovich A. S., Pankin D. V., Smirnov E. V., Tolochko O. V., Panov M. S., Churbanov M. F., Skripachev I. V., Shevelko M. M. // Chem. Mater. 2022. V. 34. Iss. 6. P. 2743–2751. <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04312>.
- [5]. Yang D., Shi X.-L., Li M., Nisar M., Mansoor A., Chen S., Chen Y., Li F., Ma H., Liang G. X., Zhang X., Liu W., Fan P., Zheng Z., Chen Z.-G. // Nature Communications. 2024. V. 15. P. 923. 11p.
- [6]. Liu Y., Zhang Q., Huang A., Zhang K., Wan S., Chen H., Fu Y., Zuo W., Wang Y., Cao X., Wang L., Lemmer U., Jiang W. // Nature Communications. 2024. V. 15. P. 2141. 11p.
- [7]. Wang Y., Yang L., Zheng Y., Wang D., Deng Y. J. // Appl. Phys. 2023. V. 133. P. 110901. doi: 10.1063/5.0135663
- [8]. Wang Z., Luo S.-H., Zhang X., Guo S., Li P., Yan S. // Journal of Non-Crystalline Solids. 2023. V. 619. P. 122581.
- [9]. Ohtomoto T., Hayashi A., Tatsumisago M., Kawamoto K. // Electrochemistry. 2013. V. 81(6). P. 428431.
- [10]. Tveryanovich Yu.S., Fazletdinov T.R., Tverjanovich A.S., Fadin Yu.A., Nikolskii A.B. // Russian Journal of General Chemistry. 2020. V. 90. N11. P. 2203–2204.
- [11]. Evarestov R.A, Panin A.I, Tverjanovich Y.S. // Journal of Computational Chemistry. 2021. V. 42. Iss. 4. P. 242-247.
- [12]. Tveryanovich Y. S., Fazletdinov T. R., Tverjanovich A. S., Pankin D. V., Smirnov E. V., Tolochko O. V., Panov M. S., Churbanov M. F., Skripachev I. V., Shevelko M. M. // Chem. Mater. 2022. V. 34. Iss. 6. P. 2743–2751.

# **Фундаментальные и прикладные проблемы ионики твердого тела**

Принято к печати

Федеральным исследовательским центром проблем  
химической физики и медицинской химии РАН

Составители: Писарева А.В., Писарев Р.В., Букун И.Г.

*Отпечатано с авторских оригиналов*

**Формат 60x90/16.**

**Тираж 150 экз.**

**Заказ № 1620.**

Отпечатано с ООО «Издательский дом «Граница»

Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Тел.: +7 499 259-88-13, +7 495 971-00-75

E-mail: [granica\\_publish@mail.ru](mailto:granica_publish@mail.ru)

<http://granicagroup.ru>

---

**УДК 544**

**ББК 22.333**

**Ф 947**

**ISBN 978-5-9933-0507-3**